



[综述](#)

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[后一篇](#) >>

追随物理学发展的质量分析技术：从杆秤到质谱仪

丁传凡¹; 方向²

1. 复旦大学化学系激光光学研究所, 上海200433; 2. 国家标准化管理委员会, 北京100088

The Mass Analysis Based on the Development of Physics: from the Steelyard to Mass Spectrometer

DING Chuan-fan¹; FANG Xiang²

1. Department of Chemistry and Laser Chemistry Institute, Fudan University, Shanghai 200433, China; 2. Standardization Administration of the People's Republic of China, Beijing 100088, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献\(29\)](#)

[相关文章\(15\)](#)

?

版权所有 © 2013 《质谱学报》编辑部

通讯地址: 北京275信箱65分箱 邮政编码: 102413

Tel: (010)69357734 Fax: 010-69357285 E-mail: jcmss401@163.com

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn